



SEMI Standards Publication Certificate

SEMI 标准发布证书

NO.: 2020-04

Standard No.: SEMI PV 94-0420
标准编号: SEMI PV 94-0420

Standard Name: New Standard: Guide for Identifying Cell Defects
in Crystalline Silicon Photovoltaic (PV) Modules
by Electroluminescence (EL) Imaging

标准名称: 晶体硅光伏组件电池片缺陷电致发光测试方法

Publication Date: April, 2020

发布日期: 2020年4月



标准编制工作组

SEMI PV 94-0420

主编单位: 天合光能股份有限公司、常熟阿特斯阳光电力科技
有限公司、福建省计量科学研究院/国家光伏产业
计量测试中心

参编单位: 中国计量科学研究院、厦门理工学院、西安交通大学、
陕西众森科技有限公司、上瓏新能源科技(上海)
有限公司、沛煜光电科技(上海)有限公司、上迈
(上海)新能源科技有限公司、南德认证检测(中国)
有限公司、常州合创检测技术有限公司、河海大学、
常州天合智慧能源工程有限公司、浙江晶科能源有限
公司、英利能源(中国)有限公司、无锡尚德太阳能
电力有限公司、黄河水电光伏产业技术公司、上海晶
澳太阳能科技有限公司、湖南红太阳新能源科技有限
公司、隆基乐叶光伏科技有限公司、国家太阳能光伏
产品质量监督检验中心(CPVT)

起草人: 闫萍、周伟、李龙云、周学峰、唐应堂、赵长瑞、
郭素琴、黎健生、杨爱军、熊利民、张俊超、林剑春、
黄国华、曾祥超、王童、陈超、朱景兵、武耀忠、
高传楼、张臻、黄美娟、李宁、张昕宇、王坤、周敏、
卢刚、徐德生、罗亮、刘松民、卢佳妍